

中華民國專利證書

發明第 I 886056 號

發明名稱：具有全域反捲積表面形貌重建的線掃描彩色共焦量測系統

專利權人：國立臺灣大學

發明人：陳亮嘉、蔡翰儒

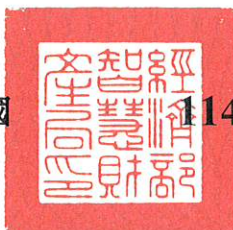
專利權期間：自 2025 年 6 月 1 日至 2044 年 9 月 29 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



114 年 6 月 1 日

